

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成 17 年 9 月 8 日 (2005.9.8)

【公開番号】特開 2002-333464 (P2002-333464A)
 【公開日】平成 14 年 11 月 22 日 (2002.11.22)
 【出願番号】特願 2002-92565 (P2002-92565)
 【国際特許分類第 7 版】

G 0 1 R 31/28

G 0 1 R 31/319

【F I】

G 0 1 R 31/28 H

G 0 1 R 31/28 R

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 3 月 17 日 (2005.3.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

刺激信号を被試験素子 (D U T) へと印加する信号発生器と、
 印加された前記刺激信号に対する応答信号を前記 D U T から受信する受信ユニットと、
 前記応答信号のデータの流を前記 D U T と前記受信ユニットとの間で同期させる同期
 ユニットとを具備した、前記 D U T を試験する試験装置であって、前記同期ユニットが、第
一のクロック信号を前記 D U T から、第二のクロック信号を前記試験装置から受けるこ
とを特徴とし、

前記同期ユニットは、

データをバッファするバッファと、

前記 D U T からのデータを前記バッファへと書き込む書き込みユニットと、

前記バッファから前記受信ユニットへと供給すべきデータを読み出す読み出しユニッ
 トとを含むことを特徴とし、前記バッファに対する書き込みアクセスが前記第一のクロッ
 ク信号により制御され、前記バッファに対する読み出しアクセスが前記第二のクロック信
 号により制御されることを特徴とした前記 D U T を試験する試験装置。

【請求項 2】

前記バッファが複数のレジスタを備えたレジスタ構造を持つことを特徴とした請求項 1
に記載の試験装置。

【請求項 3】

前記複数のレジスタ間を移動して前記複数のレジスタのうち前記 D U T からのデータを
 受信してバッファするべき 1 つを定義する書き込みポイントと、前記複数のレジスタ間を
 移動して前記複数のレジスタのうち読み出しを行うべき 1 つを指示する読み出しポイン
 タとを更に含む請求項 2 に記載の試験装置。

【請求項 4】

前記書き込みポイントが、前記 D U T からの連続データワードを様々なレジスタへと連
 続的に書き込む為に前記第一のクロック信号で動作するように適合し、前記読み出しポイ
 ントが、前記複数のレジスタ中にバッファされた連続データワードを連続的に読み出す為
 に前記第二のクロック信号で動作するように適合していることを特徴とする請求項 3 に記
 載の試験装置。

【請求項 5】

前記書き込みユニットが、前記第一のクロック信号により制御されるラッチを含み、これにより連続データワードを前記第一のクロック信号によってラッチし、これに従い前記バッファ中へと連続的に書き込むことが可能であることを特徴とする請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の試験装置。

【請求項 6】

前記バッファが、第一の有効書き込みアクセスと第一の有効読み出しアクセスとの間に初期遅延時間を設けるように適合したことを特徴とする請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載の試験装置。

【請求項 7】

前記初期遅延時間が、書き込み及び読み出しアクセス間の最大期待差に依存して設定されることを特徴とする請求項 6 に記載の試験装置。

【請求項 8】

被試験素子 (DUT) を試験する方法であって、

(a) 刺激信号を前記 DUT へ印加するステップと、

(b) 前記刺激信号に呼応して前記 DUT から送られるデータをバッファへと書き込むステップであって、前記バッファに対する書き込みアクセスが、前記 DUT からの第一のクロック信号により制御されることを特徴とするステップと、

(c) 受信ユニットへ供給すべきデータを前記バッファから読み出すステップであって、前記バッファに対する読み出しアクセスが前記受信ユニットからの第二のクロック信号により制御されることを特徴とするステップと、

(d) 前記刺激信号に呼応して、読み出された前記データを前記受信ユニットにより受信するステップと

を含む方法。

【請求項 9】

第一の有効書き込みアクセス及び / 又は第一の有効読み出しアクセスを初期化するステップを、更に含む請求項 8 に記載の方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】試験装置及びその方法